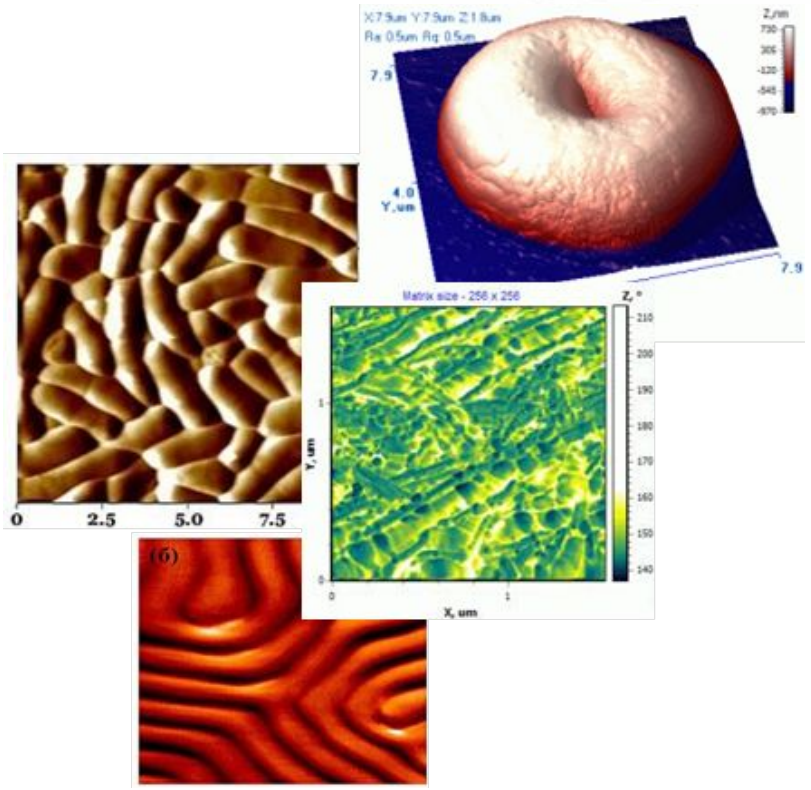
ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Мультифункциональный сканирующий зондовый микроскоп NT-206

Области применения:

- Физика твердого тела
- Микроэлектроника
- Оптика
- Тонкопленочные технологии
- Нанотехнологии
- Полупроводниковые технологии
- Микро- и нанотрибология
- Анализ поверхностей
- Полимеры и композиты
- Биологические клетки, мембраны



ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Автоматический титратор T50 Mettler-Toledo

Области применения:

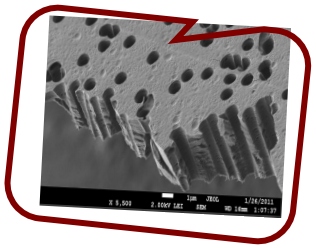
- Кислотно-основное титрование
- Окислительно-восстановительное титрование
- Титрование по методу Карла Фишера
- Прямое измерение pH, концентрации ионов и УЭП
- pH-статирование
- Вольтамперометрическое титрование

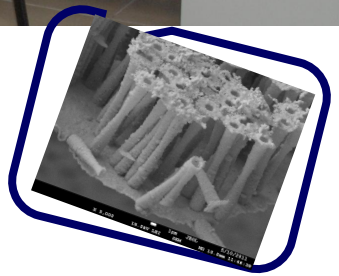
ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Растровый электронный микроскоп JEOL JSM-7500F

Данный прибор уникален тем, что даже при низком ускоряющем напряжении он обеспечивает сверхвысокое разрешение (1,4нм при 1кВ). Это делает JSM-7500F прекрасным инструментом для анализа трековых мембран, текстуры наноструктурных объектов, особенно тех, которые чувствительны к воздействию электронных пучков.





ЛАБОРАТОРИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ПРОФИЛЯ

ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

Установка импульсной спектрометрии

Технические характеристики

- спектральная область измерений:200–1200 *нм*;
- временное разрешение: 7 *нс*;
- температурный диапазон измерений:12,5–700 *К*;
- временной диапазон измерений: 10^{-8}– 10^{4} с;
- максимальная энергия возбуждающих
- электронов: 400 *кэВ*,
- длительность импульса тока электронов: 2–10 *нс*;
- диапазон возможных плотностей тока пучка электронов: 0,001–1000 *А/см*^{2}.